縮退 ZnO:Ga 薄膜中のフェルミエッジ異常と励起子生成

Fermi edge singularity and related exciton generation in degenerate ZnO:Ga thin film

神戸大¹,物質・材料研究機構² ⁰(M1)田代 愛佳¹,安達 裕²,内野 隆司¹

Kobe Univ.¹, National institute for Materials Science², ^oA. Tashiro¹, Y. Adachi², T. Uchino¹

E-mail: 211s212s@stu.kobe-u.ac.jp

【緒言】直接遷移型 II-VI族ワイドギャップ半導体である酸化亜鉛は、約60 meV と高い励起子結 合エネルギーを持つことから、励起子発光を用いた半導体レーザーへの応用が期待されている。 近年我々は、薄膜の膜厚効果[1]、ならびに Mg ドープに伴うバンドギャップ変調効果[2]が影響を 及ぼす ZnO 薄膜の励起子誘導放出過程を明らかにした。一般に、このような励起子由来の光学過 程は、キャリア濃度が Mot 密度(約1×10¹⁸ cm⁻³)を超えると励起子が解離するため観測されない と考えられてきた。しかし、Mot 密度以上の試料であっても、光励起で生じた1 個の局在化した 正孔と伝導帯中の Burstein-Moss シフトによって上昇したフェルミエネルギー近傍の複数の電子 との相互作用により、フェルミエッジ付近の異常吸収とそれに伴う励起子(Mahan 励起子)生成 が起こりうるという考えもまた提唱されている[3,4]。そこで本研究では、Mott 密度以上の ZnO 薄 膜の光学特性を調べるため、高 Ga ドープ ZnO 薄膜の吸収・発光スペクトルを測定した。

【実験方法】 試料にはパルスレーザー蒸着 (PLD) 法により作製した膜厚 249 nm の非ドープ ZnO 薄膜と膜厚 207 nm の Ga 0.1%ドープ ZnO 薄膜を用いた。以下それぞれ ZnO 膜, GZO 膜と記載す る。これらの試料につき,ホール測定,光吸収スペクトル測定,PL スペクトル測定を行った。PL 測定は励起源に波長 355 nm パルス幅 10 ns の Nd:YAG レーザーを使用し,励起フルエンス域 0.52-39 mJ/cm² で測定した。

【結果】ホール測定の結果, ZnO 膜と GZO 膜のキャリア濃度は 200×10³ それぞれ 2.7×10¹⁶ cm³, 9.2×10¹⁹ cm³であり, Mott 密度を超え る GZO 膜の生成が確認できた。Fig. 1 に GZO 膜の温度別光吸収 スペクトルを示す。約 150 K 以下の温度域で, 3.38 eV 近傍に新 たなピークが生じることがわかった。このピークは緒言で述べた フェルミエッジ近傍の異常吸収によると推察される。事実, この 吸収スペクトルはフェルミエッジ異常吸収を考慮した理論式で フィッティング可能であるることが分かった。したがって, この ピークは Mahan 励起子の生成に伴う吸収であると推察される。

続いて,発光過程においても Mahan 励起子に由来する現象が現 れるか調べるため、3 K における ZnO 膜、GZO 膜の発光スペク トルを測定した。その結果、両試料で励起子に由来する自然放出 ピークを観測した。さらに、励起フルエンスの上昇に伴い、誘導 放出に由来する発光を両試料で観測した。誘導放出ピークエネル ギーを励起フルエンスの3分の1乗に対してプロットしたところ (Fig. 2) ZnO 膜では全フルエンス域で直線関係になり、この誘導 放出は EHP 過程であることが分かった。一方 GZO では、8 mJ/cm² 以下のフルエンスでは、発光ピークエネルギーはフルエンスに依 存せずほぼ一定値を取ることが分かった。したがって、8 mJ/cm² 以下のフルエンス領域において観測された GZO の誘導放出は EHP 過程ではなく励起子過程に由来すると考えられる。このよう な GZO の光吸収及び発光スペクトルの測定結果は、 Mott 密度 以上のキャリア濃度領域においても励起子(Mahan 励起子)の生 成が可能であるという理論予測を強く支持している。

R. Matsuzaki, H. Soma, K. Fukuoka, K. Kodama, A. Asahara, T. Suemoto, Y. Adachi, and T. Uchino, Phys. Rev. B 96, 125306 (2017).
S. Fujii, Y. Adachi, and T. Uchino, Phys. Rev. B 102, 075204 (2020).
G. D. Mahan, Phys. Rev. 163, 612 (1967).
P. Palmieri, E. Baldini, A. Steinhoff et al., Nat. Commun. 11, 850 (2020).



Fig. 1 Temperature dependence of the absorption spectra of the GZO film (open circles). The solid lines are the theoretical fits to the data.



Fig. 2 The peak energies of the simulated emission bands of the GZO and ZnO films vs. one-third power of the excitation fluence.